

IEEE EDS Kansai Chapterの皆様
IEEE Kansai Section の皆様

2023年9月21日
IEEE EDS Kansai Chapter Chair 木村 睦
Vice Chair 中原 健

下記の通り、第23回「関西コロキウム電子デバイスワークショップ」を開催致します。
このワークショップは毎年国際会議での発表講演、または主要ジャーナルに掲載された論文の中から
関西とその近隣に拠点を置く大学・企業等の研究者による発表を抽出・厳選して、投稿と同じ内容を
日本語で講演して頂くものです。今年も昨年につき、オンラインでの開催となりました。
皆様のご参加をお待ち申し上げます。

記

会議名：第23回「関西コロキウム電子デバイスワークショップ」
主 催：IEEE Electron Devices Society Kansai Chapter
日 時：2023年10月6日(金) 10:30～16:15
会 場：オンライン(Zoom)

プログラム：次ページ以降参照
公用語：日本語
参加資格：特になし（事前登録必要）
会 費：無料

申し込み方法：

参加希望者は、9/30までに 以下のGoogle フォームからお申込みください。

<https://forms.gle/qVU4iQ7E1SGjdEDA7>

Google Formが使えない方は、お手数ですが、以下の問い合わせ先にメールで直接
お申込みください。

申込者には、開催日の1週間くらい前にZoom URL 情報をメールにて連絡します。

その他：

詳細は IEEE EDS 関西チャプタの HPをご確認ください。

<http://www.ieee-jp.org/section/kansai/chapter/eds/>

[お問い合わせ先]

IEEE EDS Kansai Chapter Secretary: 松田時宜 (近畿大学; matsuda (at) ele.kindai.ac.jp)

=====

<ご講演頂く皆様へ>

講演時間：20分 + 質疑：5分（日本語。一部英語）

使用器具：当日はZoomを使用します。接続用PCのご準備をよろしくお願いいたします。

開会挨拶 [10:30 - 10:35]

木村 睦 (龍谷大学)

Session I. Power and Compound Semiconductor Devices [10:35-11:25]

座長：上沼 睦典 (産総研/奈良先端大)

Breakdown Electric Field of GaN p⁺-n and p-n⁺ Junction Diodes With Various Doping Concentrations [IEEE EDL]

Takuya Maeda, Tetsuo Narita, Shinji Yamada, Tetsu Kachi, Tsunenobu Kimoto, Masahiro Horita, Jun Suda
Kyoto University

Split-Dummy-Active_CSTBT for Improving Recovery dV/dt and Turn-on Switching Loss Tradeoff [ISPSD]

Kazuya Konishi, Koichi Nishi, Kohei Sako and Akihiko Furukawa
Mitsubishi Electric Corporation

Session II. CMOS Process, Device, and Circuit [13:00-14:15]

座長：大村 泰久 (ACA)

Switched-Capacitor Voltage Boost Converter with Digital Maximum Power Point Tracking for Low-Voltage Energy Harvesting [SSDM]

Kaori Matsumoto^{1,2}, Ryuki Ikeda², Hikaru Sebe², Nobutaka Kuroki¹, Masahiro Numa¹, Daisuke Kanemoto², and Tetsuya Hirose²
¹*Kobe University*, ²*Osaka University*

Synaptic characteristics of ferroelectric capacitors for neuromorphic systems [AMFPD]

Yuma Ishisaki, Osuke Tanaka, Takumi Kuwahara, Hidenori Kawanishi and Mutsumi Kimura
Ryukoku University

Neutron-induced stuck error bits and their recovery in DRAMs on GPU cards [SSDM]

Masanori Hashimoto¹, Yangchao Zhang², Kojiro Ito²
¹*Kyoto University*, ²*Osaka University*

Session III. Optoelectronics, Displays, and Imagers [14:20-15:35]

座長：櫻野 勝之 ((株) リコー)

Aging-Robust Amplifier Design Using Low Voltage Organic Semiconductor Loads [SSDM]

Yuto Kaneiwa, Kazunori Kuribara, and Takashi Sato
Kyoto University

Character inference learning for stacked neuromorphic devices using IGZO thin films [AMFPD]

Etsuko Iwagi, Mutsumi Kimura
Ryukoku University

Highly Stable Carbon-Based Multi-Porous-Layered-Electrode Perovskite

Solar Cells [AMFPD]

Seigo Ito, Youichirou Sakai, Ryuki Tsuji, Takaya Shioki and Kota Ohishi
University of Hyogo

Session IV. Power and Compound Semiconductor Devices 2 [15:35-16:00]

座長：上沼 睦典（産総研/奈良先端大）

SiC Complementary Junction Field-Effect Transistor Logic Gate Operation at
623 K [IEEE EDL]

Mitsuaki Kaneko, Masashi Nakajima, Qimin Jin, Tsunenobu Kimoto
Kyoto University

AWARD授与 [16:00-16:10]

佐藤 伸吾（関西大学）

閉会挨拶 [16:10-16:15]

上田 尚宏（日清紡マイクロデバイス株式会社）